横山 晴樹 殿

本位田真一

貴殿は、入力の自然な変化に対するニューラルネットワーク出力の頑健性を 検査する手法に対し、検査の精度と効率を両立する改善に取り組みました。 現在、深層ニューラルネットワーク技術により高度な検出や分類を可能とする AI について、様々な領域で産業応用が進もうとしています。一方で、深層ニュ ーラルネットワークは、入力のわずかな変化で出力が変わる問題がよく知られ 懸念されています。この頑健性の問題について従来は、画像をピクセル単位 でいじるなど機械的なノイズを与え、テストにより限られたサンプルでの検査 を行うことが主流でした。これに対し、先行研究では、画像生成のような AI 技 術を使うことにより、機械的なノイズではなく、髪の色が変わる、首の向きが変 わるなどの力変化を考え、それでも出力が変わらないことを検査できるように なっています。さらにその研究では、限られたサンプルでのテストではなく、数 学的な形式検証により、一定範囲の入力変化に対して必ず出力が変わらない ことを保証できるようになっています。横山さんは、この先行研究に対し、その 仕組み、実装詳細までを理解し、検査の精度を下げるが効率を上げる技法に ついて、使いどころを絞り込むことで、検査の精度と効率を両立する改善を提 案、実装しました。画像生成の技術、ニューラルネットワークに対する形式検 証というように、トップエスイーの講義範囲を大きく超えた技術に対して、改善 を実装・実証した先進的な取り組みである点が高く評価されました。

以上を高く評価して優秀賞を与えることとします。

国立情報学研究所 GRACE センター長・特任教授